

La microscopie sous rayons X mou (STXM) – un outil idéal pour la recherche sur la matière molle

Adam P. HITCHCOCK

*(Canada Research Chair for Materials Research – CLS/CCRS,
Brockhouse Institute for Materials Research, McMaster University, Hamilton, Canada)*

Invité par Paul Morin

**Vendredi 28 Avril à 15h00
Amphi Pavillon Accueil Soleil**

La microscopie à balayage par transmission de rayons X (STXM) est une technique de haute performance pour l'analyse des matériaux mous – les polymères, les matériaux biologiques, et les matériaux de la nanotechnologie. Avec une résolution spatiale d'environ 30 nm, une sensibilité chimique importante, et la possibilité de mesurer les échantillons humides, le STXM donne des avantages particuliers sur synchrotron par rapport à d'autres techniques. Je présenterai des résultats récents obtenus sur la ligne 5.3.2 de l'Advanced Light Source (Berkeley, CA), dans les domaines des polymères, des biofilms (en 2 et 3 dimensions), l'électrochimie, et la lithographie chimique. Je présenterai également le statut de la ligne spectro-microscopie (STXM et PEEM) au Centre Canadien de Rayonnement Synchrotron (Saskatoon, SK).

Formalités d'entrée : accès libre dans l'amphi du Pavillon d'Accueil, si la manifestation a lieu dans le Grand Amphi Soleil du Batiment Central, merci de vous munir d'une pièce d'identité et de prévenir le secrétariat en charge de l'événement.